

H 600 AM

FÜR AUFLICHT- UND DURCHLICHTMIKROSKOPIE

FOR INCIDENT AND TRANSMITTED-LIGHT MICROSCOPY



**H 600 AM
FÜR DIE AUFLICHT- UND DURCHLICHTMIKRO-
SKOPIE IN MATERIALFORSCHUNGSINSTITUTEN, IN
DER STAHLERZEUGENDEN INDUSTRIE, IN DER
ELEKTRO-, KUNSTSTOFF- UND KERAMIKINDUSTRIE**

Qualitätskontrolle im Rahmen industrieller Entwicklung verlangt häufig die mikroskopische Untersuchung von Werkstoffen. Dabei spielt die Struktur der verwendeten Materialien eine wesentliche Rolle. Fehlstellen im Gefüge werden sichtbar, Korngrößen können bestimmt und vermessen werden, Inhomogenitäten im Material erkannt werden.

Qualitätssicherung soll vor allem dazu dienen, vermeidbare Kosten auszuschließen und gute und gesicherte Ergebnisse zu reproduzieren. Hierbei spielen Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. Dies bedeutet, dass das Mikroskop ein effizientes Arbeiten ermöglichen muss. Das H 600 AM ist speziell für diese Anforderungen konzipiert zur Untersuchung ebener, polierter Anschlüsse von Metallen, Metalllegierungen, Keramiken, Verbundwerkstoffen sowie zur Untersuchung von Fertigteilen zwecks Beurteilung der Oberfläche nach Ätz- und Polierverfahren.

Das Mikroskop H 600 AM für Auf- und Durchlicht kann sowohl als reines Auflichtmikroskop mit einem vollständigen Satz an entsprechenden Auflichtobjektiven eingesetzt werden als auch als Durchlichtmikroskop zur Untersuchung transparenter Werkstoffe oder pulverförmiger Materialien.

H 600 AM 50

Für Untersuchungen im Auflicht-Hellfeld

- Okularpaar WF 10x/18
- Achromatische EPI Objektive
EPI A 4/0,13
EPI A 10/0,30
EPI A 20/0,50
EPI A 40/0,60

H 600 AM AL/DL 50

Für Untersuchungen im Auflicht-Hellfeld, Durchlicht-Hellfeld

- Okularpaar WF 10x/18
- Achromatische EPI Objektive
EPI A 4/0,13
EPI A 10/0,30
EPI A 20/0,50
EPI A 40/0,60
- Kondensator NA 0,9

Die Ausrüstungen sind wahlweise mit Auflichtilluminator AM oder externer Faserlichtquelle erhältlich.

Maximale Objekthöhe: 53 mm

**H 600 AM
FOR INCIDENT AND TRANSMITTED-LIGHT MICRO-
SCOPY IN QUALITY ASSURANCE INSTITUTES, IN
THE STEEL-PROCESSING INDUSTRY, IN THE
ELECTRONIC, PLASTIC AND CERAMIC INDUSTRIES**

Quality assurance in the framework of industrial development often requires the microscopic investigation of component parts. The structure of the workpiece is responsible for its quality. Distortions in the structure become visible, particle sizes can be determined and inhomogeneities in the material become apparent.

Quality assurance is meant to avoid costs and produce consistent results. Rationalisation and economy also play an important role and this means that the equipment must be efficient. The H 600 AM meets these requirements for investigations of polished sections of metals, metal alloys, ceramics, composite materials, assembled units in order to investigate the surface and to assess the quality of, e.g., etching and polishing steps.

The microscope H 600 AM for incident and transmitted light can be used as a mere incident-light microscope with a set of corresponding EPI-objectives as well as a transmitted-light microscope for the investigation of transparent materials or powders.

H 600 AM 50

For incident-light investigations

- Eyepieces WF 10x/18
- Achromatic EPI objectives
EPI A 4/0.13
EPI A 10/0.30
EPI A 20/0.50
EPI A 40/0.60

H 600 AM AL/DL 50

For incident- and transmitted-light investigations

- Eyepieces WF 10x/18
- Achromatic EPI objectives
EPI A 4/0.13
EPI A 10/0.30
EPI A 20/0.50
EPI A 40/0.60
- Condensator NA 0.9

The microscopes are available either with incident light illuminator AM or with external cold light source.

Maximum object height: 53 mm



hund

Helmut Hund GmbH
Wilhelm-Will-Str. 7
D-35580 Wetzlar
Telefon: +49 (0) 6441 2004-0
Telefax: +49 (0) 6441 2004-44
E-Mail: zentrale@hund.de
Internet: www.hund.de